

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 9, 2015

Анализ влияния антиоксидантов на взаимодействие терагерцевого (субмиллиметрового) лазерного излучения с мембраной нейрона <i>Т. А. Запара, С. П. Трескова, А. С. Ратушняк</i>	5
Расчет рентгеновских спектров фотоэлектронов в широком интервале потерь энергии <i>В. П. Афанасьев, П. С. Капля, О. Ю. Головина, А. С. Грязев, Ю. О. Андреева</i>	9
Моделирование процессов агрегации наночастиц на поверхности подложки при термовакуумном осаждении <i>В. А. Жабрев, В. И. Марголин, В. А. Тупик, Chu Trong Su</i>	15
Визуализация протекания электрического тока в проводящих структурах с применением техники магнитно-силовой микроскопии <i>И. А. Руднев, М. А. Осипов, А. И. Подливаев, С. В. Покровский</i>	19
Эволюция структуры аморфной фазы в металлических стеклах типа металл—металл <i>Г. Е. Абросимова, А. С. Аронин</i>	27
Поверхностные электростатические разряды на стеклах СМГ при электронном облучении <i>Р. Х. Хасанин, Л. С. Новиков</i>	34
Формирование микроструктуры керамики многослойных актюаторов <i>О. В. Малышкина, А. Ю. Елисеев, В. А. Головин, А. В. Дайнеко, А. И. Иванова, Е. В. Барабанова</i>	40
Препарирование объектов для рэм-исследований с помощью ионной жидкости <i>О. Е. Журавлев, А. И. Иванова, Р. М. Гречишкин</i>	45
Температурные наблюдения эволюции доменной структуры триглицинсульфата методами РЭМ <i>А. И. Иванова, Р. М. Гречишкин, Н. Н. Большакова, В. А. Беляков</i>	49
Электронно-микроскопический контроль доменной структуры и полей рассеяния магнитных элементов МЭМС <i>О. В. Гасанов, А. И. Иванова, Л. Е. Афанасьева, Э. Т. Калимуллина, Р. М. Гречишкин</i>	54
Повышение точности анализа состава микрочастиц в РЭМ—РМА за счет снижения энергии электронов зонда и сглаживания их рельефа ионным пучком <i>В. Г. Дюков, В. Б. Митюхляев, В. А. Стебельков, В. В. Хорошилов</i>	58
Латеральное распределение потерь энергии пучка электронов в веществе при нормальном падении заряженных частиц на поверхность образца <i>Н. Н. Михеев, Н. А. Никифорова, А. С. Ганчев</i>	64
О возможности использования рекурсивных тригонометрических функций для расчета распределения неравновесных неосновных носителей заряда в двухслойном полупроводниковом материале <i>Е. В. Серегина, М. А. Степович, А. М. Макаренков, М. Н. Филиппов</i>	70
Структура поверхностного слоя износостойкой наплавки, обработанной высокоинтенсивным электронным пучком <i>С. В. Райков, Е. В. Капралов, Е. С. Ващук, Е. А. Будовских, В. Е. Громов, Ю. Ф. Иванов, А. Д. Тересов, К. В. Соснин</i>	75

Исследования пленок нитридов методом наведенного тока <i>Е. Б. Якимов</i>	81
Влияние обратного напряжения на оптические свойства исходных и облученных электронным пучком в РЭМ светодиодов с множественными квантовыми ямами InGaN/GaN <i>П. С. Вергелес, Е. Б. Якимов</i>	86
Взаимосвязь вторичной электронной эмиссии с параметрами электронной структуры атомов мишени <i>И. А. Подчерняева, В. М. Панашенко, А. Д. Верхотуров, Я. А. Востриков</i>	91
Особенности стимулированного низкоэнергетическим рентгеновским излучением изменения микротвердости кристаллов кремния <i>Л. П. Стебленко, С. Н. Науменко, А. Н. Курилюк, А. Н. Крит, Ю. Л. Кобзарь, Д. В. Калиниченко, П. П. Когутюк</i>	100
Структурирование упорядоченного твердого раствора $La_xCa_yF_z$ с тригональной решеткой на основе LaF_3 <i>С. К. Максимов, К. С. Максимов</i>	105
